



(11) **EP 1 835 523 B8**

(12)

## **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:

**Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)**  
Korrekturen, siehe  
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:

**G01N 23/04 (2006.01)** **H01J 37/04 (2006.01)**  
**H01J 37/26 (2006.01)**

(48) Corrigendum ausgegeben am:

**28.09.2016 Patentblatt 2016/39**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des

Hinweises auf die Patenterteilung:

**29.06.2016 Patentblatt 2016/26**

(21) Anmeldenummer: **07102803.9**

(22) Anmeldetag: **21.02.2007**

### **(54) Phasenkontrast-Elektronenmikroskop**

Phase-contrast electron microscope

Microscope à électrons à contraste de phase

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**CZ DE GB NL**

• **Matijevic, Marko**  
**72622, Nürtingen (DE)**

(30) Priorität: **14.03.2006 DE 102006011615**

(74) Vertreter: **Gnatzig, Klaus et al**  
**Carl Zeiss AG**  
**Patentabteilung**  
**73446 Oberkochen (DE)**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**19.09.2007 Patentblatt 2007/38**

(56) Entgegenhaltungen:  
**EP-A- 1 329 936 WO-A-2005/022582**  
**US-A- 2 802 110 US-A1- 2002 148 962**

(73) Patentinhaber: **Carl Zeiss Microscopy GmbH**  
**07745 Jena (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Benner, Gerd**  
**73434, Aalen (DE)**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).